

## Inhaltsverzeichnis

<b>1. New Micro-Nano-Technologies and -Components for Complex Sensors using the Example of a Glucose Sensor .....</b>	<b>9</b>
H. J. Freitag, A. Winzer, CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik GmbH, Erfurt L. Böge, MEB Ingenieurbüro, Jena	
<b>2. Direct Integration of Field Effect Transistors as Electro Mechanical Transducer for Stress on Beam Structures .....</b>	<b>13</b>
S. Haas <sup>1</sup> , N. Hafez <sup>1</sup> , K.-U. Loebel <sup>1</sup> , E. Kögel <sup>1</sup> , M. Ramsbeck <sup>1</sup> , D. Reuter <sup>1,2</sup> , J. T. Horstmann <sup>1</sup> , T. Gessner <sup>1,2</sup> <sup>1</sup> Technische Universität Chemnitz; <sup>2</sup> Fraunhofer ENAS, Chemnitz	
<b>3. Digital Microfluidics for Microchip-Based Cell Sorting .....</b>	<b>17</b>
S. Kahnert <sup>1</sup> , F. Schreiber <sup>2</sup> , A. Goehlich <sup>1</sup> , D. Greifendorf <sup>1</sup> , K. Lennartz <sup>3</sup> , U. Kirstein <sup>3</sup> , F. Bartels <sup>4</sup> , U. Janzyk <sup>4</sup> , A. Rennings <sup>2</sup> , D. Erni <sup>2</sup> , R. Küppers <sup>3</sup> , H. Vogt <sup>1</sup> <sup>1</sup> Fraunhofer IMS, Duisburg; <sup>2</sup> Universität Duisburg-Essen, <sup>3</sup> Universitätsklinikum Essen; <sup>4</sup> Bartels Mikrotechnik GmbH, Dortmund	
<b>4. Technologies for modular microsystems for the Internet of Things (IoT) .....</b>	<b>22</b>
M. Hampicke <sup>1</sup> , A. Ostmann <sup>1</sup> , D. Manassis <sup>2</sup> , J. M. Wolf <sup>1</sup> , K.-D. Lang <sup>2</sup> <sup>1</sup> Fraunhofer IZM, Berlin; <sup>2</sup> Technische Universität Berlin	
<b>5. Asymmetric resonance frequency analysis of in-plane electrothermal silicon cantilever for nanoparticle detection .....</b>	<b>28</b>
M. Bertke <sup>1,2</sup> , G. Hamdana <sup>1,2</sup> , W. Wu <sup>1,2</sup> , M. Marks <sup>1</sup> , H. S. Wasisto <sup>1,2</sup> , E. Peiner <sup>1,2</sup> <sup>1</sup> Technische Universität Braunschweig; <sup>2</sup> Laboratory for Emerging Nanometrology (LENA), Braunschweig	
<b>6. In-situ plasma etch depth control with reflectance anisotropy spectroscopy (RAS) .....</b>	<b>34</b>
C. Döring <sup>1</sup> , A. Kleinschmidt <sup>1</sup> , L. Barzen <sup>1</sup> , H. Fouckhardt <sup>1</sup> , M. Wahl <sup>2</sup> , M. Kopnaski <sup>2</sup> <sup>1</sup> Technische Universität Kaiserslautern; <sup>2</sup> IFOS Institut für Oberflächen- und Schichtanalytik GmbH, Kaiserslautern	
<b>7. Wafer- and membrane-based plasmonic sensor surfaces for ultrasensitive molecular spectroscopy .....</b>	<b>39</b>
U. Hübner, T. G. Mayerhöfer, R. Knipper, S. Patze, D. Cialla-May, K. Weber, J. Popp, Leibniz-Institut für Photonische Technologien e.V., Jena	
<b>8. Influence of low-pressure plasma treatment on the adhesion strength vacuum-produced metal-plastic composites using the example of polyamide 46 and polyamide 6 .....</b>	<b>45</b>
T. Florian <sup>1</sup> , T. Artys <sup>1</sup> , G. P. Brunotte <sup>2</sup> , J. Rami <sup>2</sup> , G. Ziegmann <sup>3</sup> <sup>1</sup> Technische Universität Clausthal; <sup>2</sup> Alape GmbH, Goslar; <sup>3</sup> Clausthal Centre of Material Technology	
<b>9. Transfer of Nanocrystalline Diamond Films Grown by Chemical Vapor Deposition for Sensors and Other Applications .....</b>	<b>50</b>
A. Behroudj, S. Strehle, University of Ulm	

<b>10. Wetting behaviour of LTCC and glasses on nanostructured silicon surfaces during sintering .....</b>	<b>54</b>
S. Gropp, M. Fischer, J. Müller, M. Hoffmann, Technische Universität Ilmenau, Institut für Mikro- und Nanotechnologien MacroNano®	
<b>11. Highly ordered silicon nanopillar by nanoparticle lithography .....</b>	<b>59</b>
G. Hamdana <sup>1,2</sup> , M. Bertke <sup>1,2</sup> , T. Südkamp <sup>3</sup> , H. Bracht <sup>3</sup> , H. S. Wasisto <sup>1,2</sup> , E. Peiner <sup>1,2</sup> <sup>1</sup> Technische Universität Braunschweig; <sup>2</sup> Laboratory for Emerging Nanometrology (LENA), Braunschweig; <sup>3</sup> Westfälische Wilhelm-Universität Münster	
<b>12. Wissensplattform zur Mikro-Nano-Integration: Das Unsichtbare sichtbar machen .....</b>	<b>64</b>
H. Krömker, M. Hoffmann, Technische Universität Ilmenau, Institut für Mikro- und Nanotechnologien MacroNano®	
<b>13. Sensors and calibration standards for precise hardness and topography measurements in micro- and nanotechnology .....</b>	<b>68</b>
U. Brand, L. Doering, S. Gao, T. Ahbe, S. Bütetisch, Z. Li, A. Felgner, R. Meeß, Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), Braunschweig; K. Hiller, Technische Universität Chemnitz; E. Peiner, Institute of Semiconductor Technology (IHT), Technische Universität Braunschweig; T. Frank, CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik und Photovoltaik GmbH, Erfurt; A. Halle, HALLE Präzisions-Kalibriernormale GmbH, Edemissen; S. Reusch, Benecke-Kaliko AG, Eislingen	
<b>14. Low temperature catalytic combustibile hydrogen MEMS gas sensor enhanced by Si-Pt nanostructures .....</b>	<b>73</b>
L. Müller, M. Hoffmann, Technische Universität Ilmenau, Institut für Mikro- und Nanotechnologien MacroNano®; K. Maier, A. Helwig, G. Müller, Airbus Group Innovations, München	
<b>15. ZnO nanorods-patterned piezoresistive Si cantilevers for humidity sensors .....</b>	<b>77</b>
J. Xu <sup>1,2</sup> , J. Yang <sup>1</sup> , W. Wu <sup>1,2</sup> , G. Hamdana, M. Bertke <sup>1,2</sup> , H. S. Wasisto <sup>1,2</sup> , E. Peiner <sup>1,2</sup> <sup>1</sup> Technische Universität Braunschweig; <sup>2</sup> Laboratory for Emerging Nanometrology (LENA), Braunschweig	
<b>16. Centrifugation of micro particles and self-assembly of nano particles by capillary bridging for 3D thermal interconnects .....</b>	<b>83</b>
C. Hofmann, M. Baum, W.-S. Wang, M. Wiemer, Fraunhofer ENAS, Chemnitz	
<b>17. Assembly of MEMS-based devices by reactive bonding .....</b>	<b>89</b>
A. Schumacher, S. Knappmann, Hahn-Schickard, Villingen-Schwenningen; G. Dietrich, E. Pflug, Fraunhofer IWS, Dresden	
<b>18. Wafer-level manufacturing and optimization of CNT-based field-effect transistors .....</b>	<b>95</b>
J. Tittmann-Otto <sup>1,2</sup> , M. Hartmann <sup>1,2</sup> , S. E. Schulz <sup>1,2,3</sup> , S. Hermann <sup>1,2,3</sup> <sup>1</sup> Technische Universität Chemnitz; <sup>2</sup> Technische Universität Dresden; <sup>3</sup> Fraunhofer ENAS, Chemnitz	
<b>19. Microstructured Metal Layers in Dye Sensitized Solar Cells .....</b>	<b>99</b>
A. Kleine, U. Hilleringmann, Universität Paderborn	
<b>20. Modeling and compensating thermal drift in time divergent AFM measurements .....</b>	<b>105</b>
J. E. Krauskopf, M. Bartenwerfer, S. Fatikow, Universität Oldenburg	
<b>21. Self-aligning integration technique for organic electronics .....</b>	<b>111</b>
T. Meyers <sup>1</sup> , F. F. Vidor <sup>1</sup> , S. F. Kaijage <sup>2</sup> , U. Hilleringmann <sup>1</sup> <sup>1</sup> Universität Paderborn; <sup>2</sup> NM-AIST – Communication Science and Engineering (CoSE), Arusha, Tansania	

<b>22. Post-CMOS integrated ALD 3D micro- and nanostructures and application for multi-electrode arrays .....</b>	<b>115</b>
A. Jupe, M. Figge, A. Goehlich, H. Vogt, Fraunhofer IMS, Duisburg	
<b>23. Nano-granular Layers for Sensor Applications fabricated by Means of Electron Beam induced Deposition .....</b>	<b>119</b>
W. Klauser, M. Bartenwerfer, P. Elfert, S. Fatikow, Universität Oldenburg	
<b>24. Process flow for integration silicon grass with metallic nanostructures in surface micromachined systems .....</b>	<b>123</b>
H. Mehner <sup>1</sup> , L. Müller, S. Biermann <sup>2</sup> , F. Hänschke <sup>3</sup> , M. Hoffmann <sup>1</sup>	
<sup>1</sup> Technische Universität Ilmenau, Institut für Mikro- und Nanotechnologien MacroNano®;	
<sup>2</sup> Micro-Hybrid Electronic GmbH, Hermsdorf; <sup>3</sup> Leibniz-Institut für Photonische Technologien e.V., Jena	
<b>25. Development of a low temperature SiC protection layer for post-CMOS MEMS fabrication utilizing vapour release technologies .....</b>	<b>126</b>
C. Walk <sup>1</sup> , Y. Chen <sup>1,2</sup> , N. Vidovic <sup>1,3</sup> , A. Kuhl <sup>1</sup> , M. Görtz <sup>1</sup> , H. Vogt <sup>1</sup>	
<sup>1</sup> Fraunhofer IMS, Duisburg; <sup>2</sup> Hochschule Karlsruhe; <sup>3</sup> IMTEK, Universität Freiburg	
<b>26. High Performance Center Functional Integration in Micro- and Nanoelectronics – Overview about the innovations and the research network and the offer to the industry .....</b>	<b>132</b>
K. Herre, Fraunhofer IPMS, Dresden	
<b>27. Gas measurement system for indoor air quality monitoring using an integrated pre-concentrator gas sensor system .....</b>	<b>136</b>
M. Leidinger <sup>1</sup> , W. Reimringer <sup>2</sup> , C. Alépée <sup>3</sup> , M. Rieger <sup>4</sup> , T. Sauerwald <sup>1</sup> , T. Conrad <sup>2</sup> , A. Schütze <sup>1</sup>	
<sup>1</sup> Universität des Saarlandes, Saarbrücken; <sup>2</sup> 3S GmbH, Saarbrücken;	
<sup>3</sup> SGX Sensortech SA, Corcelles, Schweiz; <sup>4</sup> Fraunhofer ICT, Pfinztal	
<b>28. Measurement chamber for optical in-situ concentration measurements in dispersive liquids ..</b>	<b>142</b>
M. Blech, A. Cyriax, T. Frank, H.-J. Freitag, S. Pobering, H. Wünscher, T. Ortlepp, CiS – Forschungsinstitut für Mikrosensorik GmbH, Erfurt	
<b>29. Nanotechnology meets temperature-sensitive devices .....</b>	<b>147</b>
J. Freitag <sup>1</sup> , A. T. Winzer <sup>1</sup> , I. Käpplinger <sup>1</sup> , K. Vogel <sup>2</sup> , G. Dietrich <sup>3</sup> , T. Ortlepp <sup>1</sup>	
<sup>1</sup> CiS – Forschungsinstitut für Mikrosensorik GmbH, Erfurt; <sup>2</sup> Fraunhofer ENAS Chemnitz;	
<sup>3</sup> IWS Fraunhofer Dresden	
<b>30. Post-CMOS integration of miniaturized solar cells for energy harvesting of autonomous sensor nodes .....</b>	<b>151</b>
M. Stühlmeyer, A. Goehlich, M. Figge, H. Vogt, Fraunhofer IMS, Duisburg	
<b>31. Influence of Traps on the Characteristics of ZnO Nanoparticles Thin-Film Transistors .....</b>	<b>156</b>
F. F. Vidor <sup>1</sup> , T. Meyers <sup>1</sup> , G. I. Wirth <sup>2</sup> , U. Hilleringmann <sup>1</sup>	
<sup>1</sup> Universität Paderborn; <sup>2</sup> UFRGS, Microelectronic Department, Porto Alegre, Brasilien	
<b>32. High-precision thermal diode for single-point calibration and the calibration-free temperature measurement in the range from 3 K to 500 K .....</b>	<b>162</b>
I. Tobehn <sup>1</sup> , S. Pause <sup>2</sup> , T. Ortlepp <sup>1</sup>	
<sup>1</sup> CiS – Forschungsinstitut für Mikrosensorik GmbH, Erfurt; <sup>2</sup> Universität Ilmenau	
<b>33. Integration of wet-etched GaN nanowires for vertical power transistors .....</b>	<b>167</b>
F. Yu <sup>1</sup> , S. Yao <sup>1</sup> , F. Römer <sup>2</sup> , B. Witzigmann <sup>2</sup> , H. S. Wasisto <sup>1</sup> , A. Waag <sup>1</sup>	
<sup>1</sup> Technische Universität Braunschweig; <sup>2</sup> Universität Kassel	

- 34. Making use of synthetic diamond layers for 3d micro- and nanoelectric applications ..... 171**  
M. Bähr, T. Klein, R. Täschner, T. Ortlepp, CiS – Forschungsinstitut für Mikrosensorik GmbH,  
Erfurt
- 35. Integration of Nanochannels for Lab-on-Chip-Systems ..... 175**  
M. El Khoury, S. Quednau, I. Duznovic, W. Ensinger, H. F. Schlaak, Technische Universität  
Darmstadt
- 36. Template based one-dimensional sensing nanostructures grown by atomic layer  
deposition ..... 179**  
N. Schulz, S. Riekeberg, H. K. Trieu, Technische Universität Hamburg-Harburg
- 37. Nanostructures on CMOS-intelligent sensors and actuators by post processing ..... 182**  
A. Goehlich, H. Vogt, Fraunhofer IMS, Duisburg